

2012 年国際航空宇宙展および JIMA2012 総合検査機器展に出展

田中健一郎^{*1} 田中 聡史^{*2}
Tanaka Kenichiro Tanaka Satoshi

1. 2012 年国際航空宇宙展

IIC の持つ各種計測・検査サービスを紹介することを目的として 10 月 9 日～14 日の 6 日間、ポートメッセなごやで開催された「2012 年国際航空宇宙展 (JA2012)」に IHI グループの一員として IA (IHI エアロスペース)、ICC (IHI キャスティング)、INC (アイ・エヌ・シー・エンジニアリング)、IAM (IHI エアロマニュファクチャリング) の各社と共に出展した。

国際航空宇宙展は、日本航空宇宙工業会が主催し、国内外の航空・宇宙関連分野の企業・団体が一堂に会するアジア最大規模の国際展示会であり、4 年に 1 度国内で開催されている。今回は航空宇宙産業が集積する中京地区での開催となり、IHI をはじめとした国内外の主要航空宇宙関連メーカー等約 670 社が出展した。会期中は天候にも恵まれ、IHI グループのブースには多数の見学者が訪れられた。

IIC は、航空機内装品の強度・耐久試験等航空機部品関連の各種計測技術、AE 技術の CFRP 材への適用等の非破壊検査技術、残留応力測定装置 (X3000)、Magnaflux 社製浸透探傷剤 'ZYGLO' を紹介した。

IHI グループのブースへの来場者は大手重工会

社から海外メーカー、商社、中小の部品メーカーや自動車関連産業と幅広く、航空宇宙分野を中心にさまざまな業種の方が来場された。IIC へは金属材料と合わせ複合材料に対する検査手法などについての質問が多々あり、従前以上に新素材の適用に注力されていることがうかがわれた。

[IIC の出展品]

- ・ 航空機部品関連の各種計測技術 (パネル展示)
- ・ 航空機部品関連の非破壊検査技術 (パネル展示)
- ・ X 線残留応力測定装置「X STRESS 3000」(実機展示)
- ・ Magnaflux 社製浸透探傷剤 'ZYGLO' (実機展示)

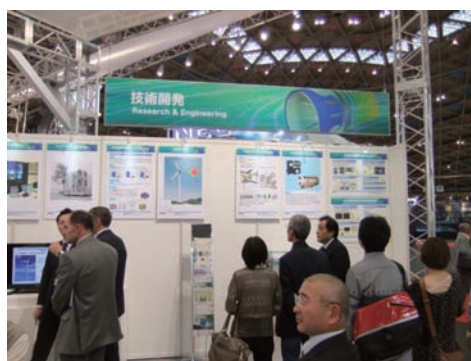


写真 1 2012 年国際航空宇宙展

*1: 営業統括部 第一グループ
*2: 営業統括部 第二グループ

2. JIMA2012

「最新の歪計測、応力測定技術」を中心に IIC の持つ検査・計測技術をさまざまな業界に紹介することを目的として、10月10日～12日の3日間、東京ビッグサイトで開催された JIMA2012 第6回総合検査機器展に出展した。

JIMA 総合検査機器展は、2年毎に日本検査機器工業会の主催で開催され、最新の検査・計測技術が一堂に集結し、それらが展示および技術セミナー等により幅広く紹介されている。

IIC は、「高温用ひずみゲージ溶射」、「X線および穿孔法による残留応力計測」、「FBG センサ（光ファイバ）計測システム」等特殊ひずみ測定を主体に AE 計測装置 AMSY-6、溶接部の可視化と解析技術等 IIC の最新の検査・計測技術を紹介した。また、合わせて、特設会場において三上技師長による無料セミナー「特殊ひずみ測定～各種残留応力、高温歪の測定～」を開催した。

今回の出展では「ひずみ・応力測定」について特集し、三上技師長によるセミナーを行ったことやブース内にひずみ・応力測定の特設コーナーを準備したこともあり、同技術に関する問い合わせや具体的なお相談が多く寄せられた。また、AE やインプロセスサポートソフトに関しても IIC が検査・計測の会社とは知っていたが、このような技術があるとは知らなかったとのお話もあり IIC の技術を広く知っていただくことができた。

会期中の総来場者は 11,820 名で、IIC のブースには鉄鋼・自動車業界他さまざまな業界から約

210 名の来場者があった。ご意見やご相談については順次フォローしている。

[IIC の出展品]

- ・ 高温用ひずみゲージ溶射サービス（パネル展示）
- ・ 穿孔法による残留応力測定サービス（パネル展示）
- ・ X線残留応力測定装置「X STRESS 3000」（実機展示）
- ・ FBG センサ（光ファイバ）計測システム（実機展示）
- ・ 溶接部可視化・解析技術（ビデオ映像）
- ・ AE 計測装置 AMSY-6（実機展示）



写真 2 JIMA2012 総合検査機器展



写真 3 セミナー会場



営業統括部
第一グループ
田中 健一郎

TEL. 03-3778-7906
FAX. 03-3778-7952



営業統括部
第二グループ
田中 聡史

TEL. 03-3778-7938
FAX. 03-3778-7952